

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 29: Zkouška zavření

ČSN
EN 60749-29
ed. 2
35 8799

idt IEC 60749-29:2011

Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods -
Part 29: Latch-up test

Dispositifs a semiconducteurs - Méthodes d'essai mécaniques et climatiques -
Partie 29: Essai de verrouillage

Halbleiterbauelemente - Mechanische und klimatische Prüfverfahren -
Teil 29: Latch-up-Prüfung

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 60749-29:2011. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 60749-29:2011. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2014-05-12 se nahrazuje ČSN EN 60749-29 (35 8799) ze září 2004, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato norma zahrnuje I-zkoušku a přepětovou zkoušku zavření pro integrované obvody.

Tato zkouška je považována za destruktivní.

Účelem této zkoušky je stanovit metodu, která určí zavření (Latch-up) integrovaných obvodů (IO) a definuje kriteria poruch zavření. Charakteristiky zavření jsou používány na stanovení spolehlivosti výrobku „zjištění bezporuchovosti“ (NTF) a minimalizaci poruchy způsobené „elektrickým přepětím“ (EOS) během zkoušky zavření.

Tuto zkušební metodu je možno aplikovat pro CMOS součástky. Použitelnost pro ostatní technologie musí být stanovena.

Klasifikace zkoušek zavření jako funkce teploty je definována v 3.1 a kriteria úrovně poruch jsou uvedena v 3.2.

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může do 2014-05-12 používat dosud platná ČSN EN 60749-29 (35 8799) ze září 2004, v souladu s předmluvou k EN 60749-29:2011.

Změny proti předchozím normám

Do normy byly zahrnuty oproti EN 60749-29:2003 následující změny:

- byl uveden menší počet technických změn;
- byly přidány dvě nové přílohy, které zahrnují zkoušení speciálních vývodů a teplotní výpočty.

Vypracování normy

Zpracovatel: VUT FEKT Brno, IČ 00216305, Doc. Ing. Josef Šandera, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 102 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.